طراحی و بهینهسازی سلولهای خورشیدی ناهمگون دورویه با لایه نازک ذاتی ریزبلوری

الناز شبرنگ '، على شاەحسىنى*'

ٔ دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکاره مهندسی برق، پزشکی و مکاترونیک، قزوین، ایران.

تاريخ ثبت اوليه: ١٣٩٣/٢/٢١، تاريخ دريافت نسخهٔ اصلاحشده: ١٣٩٥/٢/٢٣، تاريخ پذيرش قطعي: ١٣٩٥/۶/٢

چکیده در این مقاله، یک سلول خورشیدی ناهمگون با دو لایه ذاتی ریزبلوری با استفاده از نرمافزار AFORS-HET طراحی و بهینهسازی شده است. ساختار شبیهسازی به صورت TCO/a-Si:H(i)/c-Si(p)/µc-Si:H(i)/SSF/TCO/Ag طراحی و بهینهسازی شده است. ساحی تحتانی (BSF) اثر پارامترهای مختلفی مانند: تغییر ضخامت لایه ذاتی تحتانی، ضخامت ویفر، نقص چگالی لایه واسط و با استفاده از سه نوع مختلف لایه میدان سطحی تحتانی و مقایسه خروجیهای بدست آمده از این سه نوع ساختار با ساختاری که بدون لایه میدان سطحی تحتانی است، راندمان سلول خورشیدی مورد مطالعه قرار می گیرد و در بهترین حالت موجود مقدار بهینه به ازای سلول انتخاب می شود. شایان ذکر است با توجه به نتایج شبیهسازی، استفاده از لایه ذاتی ریزبلوری بین لایههای (p-Si:H(n)/c-Si(p)/a-Si:H(n)/c-Si(p)/a-Si-Si-Si) می مواد سیلیکانی به مقدار عددی ۲۸ ٪ می شود.

كلمات كليدى: سلول خورشيدى سيليكاني، ميدان سطحى تحتاني، لايه ذاتي.

Simulation and Optimization of Bifacial Solar Cells with a Hetero-Junction MicroCrystalline Intrinsic thin layer

Elnaz Shabrang¹, Ali Shahhoseini^{*1}

¹Islamic Azad University, Department of Electrical, Biomedical and Mechatronics Engineering, Qazvin, Iran.

Abstract In this paper, the TCO/a-Si:H(n)/ μ c-Si:H(i)/c-Si(p)/ μ c-Si:H(i)/BSF/TCO/Ag Bifacial HIT (Heterojunction with intrinsic thin-layer) solar cells was analyzed and designed by AFORS-HET Software. We consider the emitter and BSF layers thickness is constant, then the influences of wafer and intrinsic layer thickness, Densities of interface defects (D_{it}), and using three different types BSF layer and compare the output from these three types of structure with structure without the BSF layer, Solar cell efficiency is studied And the best available mode for optimum cell is selected. It is noteworthy that according to the simulation results, use a layer of intrinsic microcrystalline layer of a-Si: H (n) / c-Si (p) and c-Si (p) / a-Si: H (p +) Density of states and combined carriers reduce, Increase the efficiency of silicon solar cells is the numerical value of 28%.

Keywords: Silicon solar cells, Back Surface Field (BSF), Intrinsic Layers).

* عهده دار مکاتبات

۱– مقدمه

رشد جهانی مصرف انرژی و افزایش گازهای گلخانهای خسارات جبران ناپذیری را در قرن اخیر برای منابع حیاتی دربر داشته است. به منظور کاهش اتکا جهانی به منابع طبیعی پایان پذیر و سوختهای مخرب محیط زیست، تلاشهای علمی فراوانی برای کاهش هزینههای تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر، از قبیل انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی امواج و انرژی زمین گرمایی صورت گرفته است. از این میان انرژی خورشید ۵۰۰۰ بار بیشتر از سایر منابع تجدیدپذیر انرژی تولید میکند و از سایر مزایای انرژی خورشید میتوان به رایگان و در دسترس بودن، پاک و بدون آلودگی (حذف انتشار گازهای گلخانه ای از جمله دی اکسید کربن)، و امن و بیخطر بودن آن اشاره کرد و همین امر سبب شده است که در سالهای اخیر استفاده از این انرژی مورد توجه قرار گیرد. متداولترین و بهترین سلولهایخورشیدی از نیمهرسانای سیلیکانی که ۲۷/۷٪ پوسته زمین را تشکیل میدهد [۱]، ساخته میشوند اگر توسط هر فوتون که با سلولخورشیدی برخورد میکرد، بازترکیبی صورت نمی گرفت و یک الکترون جدا می شد، سلول می توانست تمام نوری را که به آن میرسید را به الکتریسیته تبدیل کند، در حالی که بازده سلولهایخورشیدی واقعی ۵ تا ۲۰ درصد است [۱]. سلول های خورشیدی سیلیکان بلوری راندمان بالایی دارند ولی با وجود این، هزینههای ساخت این سلولها و دماي مورد نياز ساخت لايهها (ويفر...) بالا مي باشد، در همین راستا توسعه تکنولوژی سلولهایخورشیدی فیلم نازک که در کاهش هزینه نقش مهمی دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است [۴-۲]. سلولهایخورشیدی فیلم نازک ناهمگون با لایه ذاتی (Intrinsic) نخستین بار توسط سانیو ال تی دی (SANYO.LTD) درسال ۱۹۹۴به منظور کاهش هزینه ساخت و دستیابی به راندمان بالا با استفاده از زیر لایه (Substrate) نوع n توسعه یافت [۵–۲]، امروزه به دلیل استفاده فراوان از زیرلایه نوع p در صنعت فوتوولتائیک مطالعات بسیاری در این زمینه صورت گرفته است [۶]. به منظور افزایش راندمان، توسعه ساختارهای دورویه (Bifacial) و استفاده از لایه میدان سطحی تحتانی در ساختارهای سلولهای ناهمگون بسیار مورد توجه قرار گرفتهاست [۷،۸ و۹] اخیراً

سلولهای خورشیدی با راندمان ۲۵٪ [۱۱–۱۰] و ۲۵۶٪ [۱۲] توسعه یافته و سانیو در صدد است تا با کاهش ضخامت ویفر سیلیکان بلوری، هزینههای ساخت HIT را به حداقل برساند. سلولهای خورشیدی HIT شامل یک لایه نازک سیلیکان آمورف که بر روی جاذب سیلیکان بلوری رشد داده شده، میباشد. در این سلولها، رسانایی اندک سیلیکان آمورف میباشد. در این سلولها، رسانایی اندک سیلیکان آمورف میشود تا تلفات مقاومتی و نیز خسارتهای بازتاب شار فوتون را کاهش دهد. در سلولهای خورشیدی ناهمگون با لایه ذاتی، لایه واسط (a-Si:H(n)/c-Si) از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا خصوصیات پیوند (Junction) تعیین کننده راندمان سلولخورشیدی میباشد [۱۰].

تحقیق انجام شده شامل بخش های زیر میباشد، ابتدا در بخش ۲ ساختاری جدید، از طریق نشاندن یک لایه نازک ذاتی ریز بلوری دوپینگ نشده در سمت تحتانی سلول معرفی می شود، سپس در بخش ۳ با استفاده از نرمافزار شبیه ساز AFORS-HET پارامترهای هر لایه و توزیع حالات نقص در لایه های ساختار ناهمگون با دو لایه ذاتی ریز بلوری در روند مدل سازی بیان می شود و بخش ۴ ابتدا با اشاره ای بر شبیه سازی های انجام شده در این راستا، اثر پارامترهای مختلفی بر ولتاژ مدار باز، جریان اتصال کوتاه، عامل پر شدگی و راندمان ضمن توصیف تأثیر هر کدام از پارامترهای مطالعه شده بر عملکرد سلول مقادیر بهینه نتیجه گیری می شود و امید است این بهینه سازی مقدمه ای بر توسعه هر چه بیشتر تکنولوژی سلول های THT راندمان بالا قرار گیرد..

۲- روش تحقيق

تاکنون مطالعات فراوانی بر ساختارهای سلولهای خورشیدی ناهمگون با یا بدون لایه ذاتی صورت گرفته است. استفاده از لایه ذاتی دوپینگ نشده بین لایه امیتر و ویفر (دوپینگ شده) که چگالی حالات کمتری نسبت به لایههای دوپینگ شده دارد، سبب میشود چگالی لایه واسط ناهمگون ایجاد شده بین لایه ذاتی/ویفر نسبت به لایه واسط ناهمگون ایجاد شده با لایه امیتر دوپینگ شده کمتر باشد، عملکرد سلول

بهبود یابد در این مقاله با استناد به نتایج پیشین و مطالعات صورت گرفته در زمینه سلولهای خورشیدی ناهمگون با یک یا دو لایه ذاتی، ساختار ناهمگون جدیدی را با استفاده از دو لایه ذاتی سیلیکان ریز بلوری با زیر لایه سیلیکان بلوری نوع p معرفی کردهایم. شکل ۱ نشان دهنده شماتیک ساختار اصلی شبیهسازی شده می باشد و شامل، دو لایه اکسید رسانای شفاف با سطح بافته در سمت فوقانی و تحتانی سلول و یک لایه با سطح بافته در سمت فوقانی و تحتانی سلول و یک لایه در (n) Si:H(n) و نیز یک لایه امیتر و دو لایه ذاتی سیلیکان ریز قسمت زیرین سلول می باشد. با توجه به آنچه درباره استفاده

TCO a-Si:H(n)
μc-si:H(i)
c-Si(p)
μc-si:H(i)
BSF
тсо
Ag

شکل ۱. شماتیک ساختار سلولخورشیدی شبیهسازی شده.

a-Si:H(n)	μc-Si:H(i)	c-Si(p)	a-Si:H(p+)	پارامترها
٣	٣	۳×۱۰۵	١٠	ضخامت لايه(nm)
11/9	11/9	11/9	11/9	ثابت دىالكتريك
٣/٩	k	۴/۰۵	٣/٩	الكترونخواهي(eV)
۲/۷۲	١/٢	1/174	1/VY	انرژی گپ(eV)
۲/۷۲	١/٢	1/174	1/VY	انرژی گپ نوری(eV)
۱. ۲.	۳×۱۰۱۹	۲/٨×۱۰۱۹	۱.۲.	چگالی باند ظرفیت(^۳ -Cm)
۱. ^{۲.}	۲×۱۰۱۹	1/• ¥×1•19	١.*.	چگالی باند هدایت(^۳ -Cm)
۵	۵۰	4.71	۵	موبیلیتی الکترون('Cm ^{-''} V-''s)
١	۵	417/9	١ ١	موبیلیتی حفرہ('Cm ^{-'} V ^{-'} s))
•	•	1/0×1.19	۱۰ ^{۲.}	غلظت دوپینگ پذیرنده(Cm)
۱۰ ^{۱۹}	•	•	· ·	غلظت دوپینگ دهنده(^۲ °Cm)
۱.۲	١.*	۱۰ ^۷	۱۰ ^۷	سرعت حرارتی الکترون(¹⁻ Cms))
۱.۲	١.*	۱۰ ^۷	۱۰ ^۷	سرعت حرارتی حفرہ(¹⁻ Cms)
۲/۳۲۸	۲/۳۲۸	۲/۳۲۸	۲/۳۲۸	چگالی لایهها(^{-۲})
•	•	۲/۲×۱۰ ^{-۳۱}	•	ضریب بازترکیبی اوژه الکترون(^{'-Cm-*} s)
•	•	٩/٩×١٠-٣٢	•	ضریب بازترکیبی اوژه حفره(^{۲۰} ۰'Cm)
•	•	•	•	ضریب بازترکیبی باند- تا-باند(^{۲۰} 's)

جدول ۱ [۱۴–۱۳]. مقادیر پارامترها در سلول خورشیدی ناهمگون با لایه ذاتی ریزبلوری .

از یک لایه ذاتی گفته شد می توان اظهار داشت که با استفاده از دو لایه نازک ذاتی سیلیکان ریز بلوری در دو طرف ویفر نقص در سطح آن و لایه واسط ناهمگون بیشتر کاهش یافته و تأثیری مثبت بر عملکرد سلول خواهد داشت. طرف ویفر نقص در سطح آن و لایه واسط ناهمگون بیشتر کاهش یافته و تأثیری مثبت بر عملکرد سلول خواهد داشت.

۳– مدلسازی

شبیهسازی ساختار سلولخورشیدی ناهمگون با استفاده از نرمافزار AFORS-HET که یک شبیهساز عددی ساختارهای ناهمگون است و معادلات یک بعدی نیمههادی را بر اساس آمار بازترکیبی شاکلی- رید- هال حل میکند، صورت گرفته است [۱۴–۱۳]. برخی از پارامترهای شبیهسازی به ازای لایههای امیتر و ویفر و دو لایه ذاتی سیلیکان ریز بلوری و میدان سطحی تحتانی براساس مقادیر پیشفرض در نرمافزار





AFORS-HET میباشد که در جدول ۱ بیان شده است. شکل ۲. (الف)، نقص چگالی در سیلیکان بلوری که به صورت نقص منفرد در انرژی ۵۶/. الکترون ولت بالای لبه باند ظرفیت است را نشان میدهد. شکل ۲. (ب)، در لایههای سیلیکان آمورف، چگالی حالات شامل نوع پذیرنده الکترون (نیمه بالایی شکاف باند) و نوع پذیرنده حفره (در نیمه پایینی شکاف باند) با توزیع گوسین و دنباله باند (Band tail) میباشد. شکل ۲. (پ) و (ت) به ترتیب نشان دهنده توزیع حالات نقص به ازای لایههای (+q)HT همیباشد. میاشد. پارامترهای فتوولتایی تحت شرایط آزمایشی استاندارد، دمای ۲۵ درجه سانتی گراد، چگالی توان تابشی ۱۰۰۰ وات بر متر مربع و۵٫۱MM تعیین می شوند.

۴- نتایج شبیهسازی و بحث

در این بخش ابتدا با بررسی اجمالی در مورد ساختار





شکل۲. توزیع حالات نقص به ازای لایههای مختلف در شبیهسازی، الف. (c-Si(p+، ... (+a-Si:H(n) ب. a-Si:H(n) ... (...).

ميدان سطحي تحتاني مشاهده ميكنيم كه راندمان سلول خورشیدی به میزان ۳/۵٪ نسبت به ساختار با یک لایه ذاتی ريزبلورى افزايش مىيابد. باتوجه به نتايج شبيهسازى، شكل ٣. الف، با افزایش ضخامت لایه ذاتی از ۱ تا ۲۰ نانومتر، جریان اتصال كوتاه افزایش می یابد، علت این امر را می توان این گونه بیان کرد، که با افزایش ضخامت لایه ذاتی جذب فوتون بیشتر شده و توليد جفت الكترونحفره افزايش مييابد. با توجه به شکل ۳. ب، افزایش ضخامت لایه ذاتی تأثیری در میزان ولتاژ مدار باز سلول ندارد و مقدار ولتاژ به ازای ضخامتهای مختلف ۶۴۱/۴ میلی ولت میباشد. در ادامه روند شبیهسازی شکل ۳. پ، با توجه به (معادله ۱) و نسبت عکس عامل پرشدگی با جریان اتصال کوتاه، با افزایش جریان، عامل پرشدگی کاهش مییابد، به ازای ضخامتهایی با بیشترین مقدار جریان، عامل پرشدگی کمترین مقدار خود را خواهد داشت. در شکل ۳. ت، روند تغییرات راندمان سلول به ازای تغيير ضخامت لايه ذاتي نشان داده شده است، با افزايش ضخامت راندمان با تغییر جزیی از مقدار ٪۲۷/۹۸ تا ٪۲۸ افزایش می یابد، در نهایت بهینه مقدار راندمان را به منظور کاهش هزینههای ساخت به ازای ضخامت لایه ذاتی برابر با مقدار ۳ نانومتر،۲۷/۹۹٪ در نظر می گیریم. شکل (۳) اثر ضخامت لایه ذاتی را بر مشخصههای سلول خورشیدی نشان مىدھد.

$$F.F. = \frac{V_m I_m}{V_{OC} I_{SC}} \tag{(1)}$$

۲-۴– اثر ضخامت ويفر

با ثابت فرض کردن ضخامت سایر لایهها، هنگامی که ضخامت ویفر افزایش مییابد راندمان سلولخورشیدی هم افزایش یافته به همین دلیل مقدار بهینه راندمان به ازای ضخامت ۳۰۰ میکرومتر برای سلول خورشیدی با لایه ذاتی ریزبلوری بهدست میآید. شکل (۴) وابستگی راندمان به ضخامت ویفر رانشان میدهد.

جدول۲. پارامترهای خروجی ساختار سلول خورشیدی ناهمگون TCO/a-si:H(n)/ μc-Si:H(i)/c-Si(p) /BSF.

$(\mathbf{mV})_{V_{OC}}$	$(\mathbf{mA/cm^2})_{I_{SC}}$	% FF	%η
878	۴۸/۷	۸۲/۴۹	24/47

ارائه شده با یک لایه ذاتی سیلیکان ریز بلوری که مبنای اصلی در پیشبرد این مقاله بوده، اثر پارامترهای مختلفی از قبیل ضخامت لایه ذاتی سیلیکان ریزبلوری تحتانی بر ولتاژ مدار باز، جریان اتصال کوتاه، عامل پرشدگی و راندمان و ضخامت لایه ویفر بر راندمان و اثر لایه میدان سطحی تحتانی (با یا بدون BSF) بر پارامترهای خروجی سلول نمونه و نیز اثر نقص چگالی لایه واسط بر راندمان بررسی ومطالعه میشود. در بهترین گزارش دیده شده درباره نتایج سلولخورشیدی ناهمگون با یک لایه ذاتی ریزبلوری با ساختار -TCO/a ناهمگون با یک لایه ذاتی ریزبلوری با ساختار -SiEN SiBAR (ور)/25iH(i)/c-Si(p) ایک جریان اتصال کوتاه، عامل پرشدگی و راندمان در جدول (۲)

در این مقاله میخواهیم با ارائه ساختار سلول خورشیدی ناهمگون با دو لایه ذاتی ریزبلوری، و اعمال تغییرات بر آن، خروجی سلول خورشیدی نمونه را تا حد مطلوبی بهبود بخشیم.

۴-۱- اثرضخامت لایه ذاتی تحتانی

در سلولهای خورشیدی فیلم نازک، به دلیل نقص چگالی بالا و طول کوتاه دیفیوژن حاملهای بار در سیلیکان آمورف هیدروژنه از لایه ذاتی به عنوان جاذب استفاده کرده تا جفت الکترون-حفره تولید کند، جفتهای الکترون-حفره با استفاده از میدان الکتریکی تولید شده توسط لایههای دوپینگ شده n و q در دو طرف لایه ذاتی، جدا شده سپس حفرهها به سمت ناحیه q و الکترونها به سمت ناحیه n میروند. در اگر این دو ناحیه از طریق یک الکترود با استفاده از مدار خارجی به هم مرتبط شوند، جریان فوتونی تولید می شود. در راستای مطالعات پیشین [۱۰]، با ثابت نگه داشتن ضخامت لایه ذاتی در مقدار ۳ نانومتر در سمت فوقانی سلول و افزودن یک لایه ذاتی در سمت تحتانی ساختار بین ویفر بلوری و لایه



شكل٣. الف-ولتاژ مدارباز، ب-جريان اتصالكوتاه، پ-عامل پرشدگي ت-راندمان به عنوان تابعي از ضخامت لايه ذاتي.



شکل۴. راندمان سلول خورشیدی شبیهسازی شده تابعی از ضخامت ویفر.

۴–۳– اثر BSF بر راندمان سلول خورشیدی

با استفاده از ساختارهای همگون +n/n و +p/p عنوان لایه غیر فعال اثر میدان، در سمت تحتانی سلولهای خورشیدی می توان اثر بازترکیبی را کاهش داد تا راندمان بهینه

به دست آید. شکل (۵) دیاگرام باند ساختار +p/p را نشان میدهد. شکاف انرژی بالا و آفست بزرگ باند هدایت (ΔEc) در (+p)ASI انعکاس خوبی در برابر انتقال الکترونها ایجاد میکند. افزایش آفست باند ظرفیت (ΔEv) سبب میشود سدی در برابر عبور حفرهها در پیوندهای تحتانی، به وجود آید و با کاهش بازترکیبی حاملها راندمان سلول خورشیدی بهبود یابد. شکل ۶ اثر BSF بر راندمان را نشان میدهد.





۴- نتیجه گیری

در این مقاله با استفاده از نرمافزار AFORS-HET، اثر پارامترهای مختلفی از قبیل ضخامت لایه ذاتی، ضخامت ویفر، میدان سطحی تحتانی، نقص چگالی لایه واسط بر پارامترهای فتوولتائيک سلولخورشيدي مورد مطالعه قرار گرفت و با افزودن لايه ذاتي ريزبلوري تحتاني براساس نتايج به دست آمده از شبیهسازی و همچنین با تغییر ضخامت این لایه راندمان سلول خورشیدی افزایش مییابد. علت این است که لايههاي دوپينگ شده ويفر، اميتر و لايه ميدان سطحي تحتاني از چگالی نقص بالایی برخوردار هستند که استفاده از لایه ذاتی در سمت فوقانی و تحتانی سلول با در نظر گرفتن میزان غلظت دوپینگ صفر، سبب اثر ناپذیری نقص در سطح و با کاهش بازتركيبي حاملها در محل پيوند p-n، توليد جفت الكترون-حفره را افزایش داده و راندمان بهبود می یابد. به منظور كاهش هزينههاي ساخت، ضخامت بهينه لايه ذاتي ٣ نانومتر در نظر گرفته می شود و استفاده از لایه میدان سطحی تحتانی (لایه غیر فعال اثر میدان) در ساختار سلول ناهمگون نسبت به سلولهایی بدون لایه BSF با کاهش باز ترکیبی حامل ها راندمان سلول بهبود مىيابد. افزايش نقص چگالى لايه واسط به بیش از مقدار ۱۰^{۱۰} بر سانتی متر مکعب در الکترون ولت به دلیل افزایش بازترکیبی حاملها در لایه واسط سبب کاهش راندمان سلولخورشیدی میشود به همین دلیل جهت دستیابی به راندمان بهینه، میزان نقص چگالی لایه واسط را ۱۰۰۰بر سانتیمتر مکعب در الکترون ولت در نظر میگیریم، نتایج شبیهسازی نشان میدهد با افزایش ضخامت ویفر راندمان سلول افزایش مییابد و ماکزیمم مقدار راندمان در ضخامت ۳۰۰ میکرومتر حاصل می شود.



جدول۳. وابستگی پارامترهای سلول خورشیدی (با و بدون BSF) لایه

n/i/p/i/p	n/i/p/i			
$(mV) = V_{oc} \mathcal{F}^{1/4}$	$(mV) = _{Voc} $ fr./d			
$(mA/cm^2) = I_{sc} \Delta \pi / \cdot \Delta$	$(ma/cm^2) = I_{sc} \Delta V/Y$			
%=FF ∧1/10	%=FF ^Y/*			
%= ग ४∨/٩٩	%=η ٢ <i>۶/۶</i>			

عقب.	سطحى	مىدان

۴–۴– اثر نقص چگالی لایه واسط بر راندمان

با افزایش نقص چگالی لایه واسط احتمال بازترکیبی حاملها افزایش یافته، بنابراین جریان اشباع معکوس افزایش مییابد. با توجه به رابطه عکس ولتاژ مدار باز با جریان اشباع معکوس رابطه ۱-۲ ولتاژ مدار باز و عامل پرشدگی کاهش مییابد. با توجه به رابطه راندمان سلول خورشیدی (۱-۳) و ارتباط مستقیم راندمان با ولتاژ مدار باز و عامل پرشدگی، راندمان کاهش مییابد. شکل (۷) اثر چگالی نقص لایه واسط بر راندمان را نشان میدهد.

$$V_{OC} = \frac{kT}{e} Ln\left(\frac{I_{SC}}{I_{u}}\right) \tag{(Y)}$$

$$\eta = \frac{V_{oc} I_{sc} FF}{P_{in}} \tag{(4)}$$

مراجع

- Dwivedi, N. et al., Simulation approach for optimization of device structure and thickness of HIT solar cells to achieve _27% efficiency., Elsevier, *Sol Energy*, 2013, 31-41.
- Vishkasougheh, H.M. and Tunaboylu, B., Simulation of high efficiency silicon sol cells with a heterojunction with microcrystalline intrinsic thin layer., Energy Conv. & Manage., 2013, 72, pp.141–146.
- 11. Acevedo, M. et al., Modeling solar cells: a method for improving their efficiency., *Sci. Eng.*
- Como, N.H. and Acevedo, A.M., Simulation of heterojunction solar cells with AMPS-1D., *Sol. Energy*, 2010, 62-67.
- 13. Stangle, R. et al., AFORS-HET, a numerical pc-program for simulation of heterojunction solar cell, version 1.1 (open-source on demand), to be distributed for public use, Germany.
- Stangl, R. et al, AFORS-HET, version 2.2, a numerical computer program for simulation of heterojunction solar cell and measurement., *Inst Berlin, Kekuléstr.5*, D-12489
- 15. Iwaniczko, E. et al., Effective interfaces in silicon heterojunction solar cells., *IEEE*, 2005.
- Sharma, M. et al., Optimization of band gap, thickness and carrier concentrations for the development of efficient microcrystalline silicon solar cells A theoretical approach., *Sol Energy.*, 2013, 97, 176–185.
- Coignus, J et al., Key issues for accurate simulation of a-Si:H/c-Si heterojunction solar cells., *Silicon PV Freiburg*,2011, 17-20, April.

نيمه رساناها.، دانشگاه شيراز دانشكده علوم پايه گروه فيزيك.

- 2. Tucci, M et al., Comparison of amorphous/crystalline heterojunction solar cells based on n and p-type crystalline silicon., *Thin Solid Films*, 2004, 355, pp. 451–452.
- 3. Ying, Xu et al., Heterojunction solar cells with n-type nanocrystalline silicon emitters on p-type c-Si wafers., *J Non-Cryst Solids*, 2006, *352*.
- 4. Munoz, D et al., Bifacial heterojunction silicon solar cells by hot-wire CVD with open-circuit voltages exceeding 600 mV., *Thin Solid Films*,2006 511–512, 415–419.
- 5. Kleider, JP et al., Electronic and structural properties of the amorphous crystalline silicon interface., *Thin Solid Films*,2009, *517*, *6386–91*.
- 6. Zhao, L et al, Solar Energy Materials & Solar cells, 2008, 673-681.
- 7. Lisheng, W. and Fengxiang, C., Simulation of high efficiency bifacial solar cells on n-type substrate whit AFORS-HET., *Dept.phy.sci.thec,.China*, 2011.
- Dao, V.A. et al., Simulation and study of the influence of the buffer intrinsic layer, back surface field, densities of interface defects, resistivity of p-type silicon substrate and transparent conductive oxide on heterojunction with intrinsic thin-layer (HIT) solar cell., *sol.Eng*, 2010, *84*, 777-783.